

一 般 競 争 入 札 公 告

科学技術・学術政策研究所において、下記のとおり一般競争入札に付します。

- 1 競争入札に付する事項
 - (1) 件 名 科学と技術のかかわりを分析するためのデータベース
 - (2) 納入期限 入札説明書のとおり
 - (3) 納入場所 入札説明書のとおり
- 2 競争に参加する者に必要な資格
 - (1) 文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）において平成30年度に「役務の提供」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
 - (2) 入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
- 3 入札書等の提出場所等
 - (1) 入札関係書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所
郵便番号 100-0013
所在地 東京都千代田区霞が関3-2-2中央合同庁舎第7号館東館16階
機 関 名 科学技術・学術政策研究所総務課経理係
電話番号 03-3581-2391
 - (2) 入札説明会の日時及び場所
随時受付説明（9時30分～18時15分）
科学技術・学術政策研究所総務課
 - (3) 入札関係書類の受領期限
平成31年1月15日（火）13時00分
 - (4) 入札及び開札の日時及び場所
平成31年1月21日（月）11時00分
科学技術・学術政策研究所小会議室（中央合同庁舎第7号館東館16V）
- 4 入札保証金
免除する。
- 5 入札の無効
 - (1) 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第11条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
 - (2) 2（2）の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
- 6 その他
本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。

以上公告する。

平成30年12月19日

支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長
坪井 裕

仕様書

1. 件名

科学と技術のかかわりを分析するためのデータベース

2. 目的

当所では、各種の論文データベース分析により、世界の研究動向とそこでの日本の活動状況の分析を実施している。論文分析で計測されている科学知識が技術とどのようにかかわっているかを分析するために、特許が引用している論文情報についてのデータ収集を行う。

3. 仕様

対象期間: 特許: 開始年(別紙 1 参照)～最新時点までに収録された特許のうち、当所が保有するデータ(2018 年 3 月に当所へ納入されたデータ)との差分範囲
論文: 上記特許が引用する全範囲
対象範囲(特許): 世界の主要な特許受理官庁(別紙 1 参照)に出願又は登録された特許。
対象範囲(論文): Web of Science SCIE, CPCI-S, SSCI, A&HCI, CPCI-SSH
論文ドキュメントタイプ: 収録対象の全てのドキュメントタイプ
データフォーマット: テキスト形式または Microsoft Excel 形式
データ内容: 上記で指定した範囲の論文および特許を対象に、論文を引用している特許を抽出し、論文番号と特許番号の対応を示すリストを作成すること。なお、論文番号については、当所が保有する Web of Science XML と接続可能な形式で提供すること。また、特許番号のリストは PATSTAT(欧州特許庁)の特許番号と接続可能な形式で提供すること。

4. 貸与物

論文番号と特許番号の対応を示すリスト(2018 年 3 月時点のデータ)

5. 納入品

上記内容のデータベースを収録した記録ファイルフォーマット一式

6. 納入場所および納入期限等

(1) 納入場所

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 3 丁目 2 番 2 号
中央合同庁舎第 7 号館東館 16 階

(2) 納入期限

平成 31 年 3 月 29 日

7. 保証期間

請負者は、科学技術・学術政策研究所の責めによらない理由によって、当該データに欠陥等があった場合は、納入から1年間の期間内において無償で修復・交換をすること。

8. その他

本仕様に定める事項に関して疑義を生じた場合は、担当職員と協議して指示を受けるものとする。

以上

〈特許情報の収録対象とする特許受理官庁〉

特許発行国	国コード	引用の情報	収録期間
オーストラリア (Australia)	AU	特許および文献	審査官: 1993年1月以降 発明者: 1994年3月～1996年10月
オーストリア (Austria)	AT	特許および文献	審査官: 1994年3月～1996年5月; 2005年以降 発明者: 1994年3月～1996年5月
ベルギー (Belgium)	BE	特許および文献	審査官: 1987年1月以降 発明者: 1994年3月～1996年8月; 1999年10月以降
カナダ (Canada)	CA	特許および文献	発明者: 1993年1月～1996年7月
中国 (China)	CN	特許および文献	審査官: 2010年1月以降
チェコ共和国 (Czech Republic)	CZ	特許および文献	審査官: 2006年6月以降
欧州特許庁 (European Patent Office)	EP	特許および文献	審査官: 1978年12月以降 発明者: 1978年12月以降 異議申立: 1978年12月以降 第三者: 1992年1月以降
フランス (France)	FR	特許および文献	審査官: 1973年1月以降 発明者: 1994年4月以降
ドイツ (Germany)	DE	特許および文献	審査官: 1971年1月以降
日本 (Japan)	JP	特許のみ	審査官: 1994年1月以降 発明者: 1994年3月～1996年10月
韓国 (Korea)	KR	特許のみ	審査官: 2006年1月以降
ルクセンブルク (Luxembourg)	LU	特許および文献	審査官: 1999年1月以降 発明者: 2000年4月～2006年9月
マレーシア (Malaysia)	MY	特許のみ	審査官: 2006年1月以降
オランダ (Netherlands)	NL	特許および文献	審査官: 1974年1月以降 発明者: 1994年4月以降
ニュージーランド (New Zealand)	NZ	特許のみ	審査官: 1994年～1996年
ノルウェー (Norway)	NO	特許のみ	審査官: 1994年以降
フィリピン (Philippines)	PH	特許のみ	審査官: 2010年以降
ロシア (Russia)	RU	特許のみ	審査官: 2009年6月以降
シンガポール	SG	特許および文献	審査官: 2001年3月以降

(Singapore)			
南 ア フ リ カ (South Africa)	ZA	特許および文献	審査官: 1994 年 1 月以降
スペイン (Spain)	ES	特許および文献	審査官: 1993 年 1 月以降
スウェーデン (Sweden)	SE	特許および文献	審査官: 1994 年 4 月 ~ 1996 年 7 月 発明者: 1994 年 4 月 ~ 1996 年 7 月
スイス (Switzer- land)	CH	特許および文献	審査官: 1986 年 1 月以降 発明者: 1994 年 3 月 ~ 1996 年 10 月; 2001 年 1 月以降
英 国 (United Kingdom)	GB	特許および文献	審査官: 1978 年 1 月以降 発明者: 1994 年 4 月 ~ 1996 年 11 月
米 国 (United States)	US	特許および文献	審査官: 1970 年 1 月以降 発明者: 1994 年 5 月以降
WIPO	WO	特許および文献	審査官: 1978 年 1 月以降 発明者: 1994 年 1 月以降